Search Notes

A	pp	lica	tion/C	ontrol	No.

10/624,256 Examiner Applicant(s)/Patent under Reexamination YAN ET AL. Art Unit

Albert T. Chou

2616

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
370	352	4/9/2007	Ac
370	485	4/9/2007	AC
370	493	4/9/2007	Ac
370	401	4/9/2007	Ac
379	219 -	4/9/2007	AC
709	228	4/9/2007	AC
		,	
	1		

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class <sub>.</sub>	Subclass	Date	Examiner		
		-			

SEARCH   (INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEG	Y)
	DATE	EXMR
Inventor Search - EAST	4/9/2007	Ac
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		